1C18

X線吸収分光による酸化セリウムクラスターの電子状態分析

(コンポン研究所¹, 九大院理², 豊田工大³)

○早川 鉄一郎¹, 荒川 雅², 猿楽 峻², 安東 航太², 飛田 健一朗², 伊藤 智憲², 江頭 和宏¹, 寺嵜 亨^{2,3}

Electronic-Structure Analysis of Cerium Oxide Clusters by X-ray Absorption Spectroscopy

(Genesis Res. Inst., Inc.¹, Kyushu Univ.², Toyota Tech. Inst.³) OT. Hayakawa¹, M. Arakawa², S. Sarugaku², K. Ando², K. Tobita², T. Ito², K. Egashira¹, A. Terasaki^{2, 3}

酸化セリウムは酸素吸蔵・放出特性を持つことで知られ、自動車用排ガス浄化触媒の担体などに利用されている。バルク酸化セリウムの研究で、酸素の吸蔵・放出がセリウムの荷電状態変化を伴って起きることが明らかにされている。反応の微視的な研究に基づいてこの酸素貯蔵性能を理解・制御する目的で、我々は反応サイトのモデル系としてサイズ選別酸化セリウムクラスターに着目し、X線吸収分光測定を適用してクラスター内の各元素の荷電状態を計測する研究を進めている。本研究ではサイズ選別酸化セリウムクラスターのX線吸収分光測定を行い、吸収端のエネルギーシフトなどからクラスターを構成する各元素の価数を調べた。

試料密度が極めて希薄な気相クラスターに対して断面積の小さい内殻吸収を測定 するため、信号強度は微弱である。本実験では、(1)クラスター試料をイオントラッ プに蓄積してX線を長時間照射し、さらに(2)解離イオン収量法でX線吸収を高感度 に検出することで測定を可能にした。実験装置を図1に示す。酸化セリウムクラスタ ーイオンはマグネトロンスパッタ法で生成、四重極質量フィルターでサイズ選別し、 線形四重極RFイオントラップに蓄積してX線を照射した。約1秒間の照射後、トラ

ップからイオンを引き出して、X線 吸収により発生した解離イオンを 飛行時間型質量分析計により分析 した。解離イオン収量のX線エネル ギー依存性を測定し、スペクトルを 得た。本実験ではこの装置を KEK にあるシンクロトロン放射光施 設 Photon Factory に持ち込み、実 験ステーション BL-7A に接続して 測定を行った。



図 1. X線吸収測定装置の概略図。赤はクラスター イオンの飛行経路、青はX線ビームを表す。

生成したクラスターの質量スペ クトルから、Ce₂O₃⁺および Ce₂O₅⁺ が安定種として生成していること が分かり、これらのクラスターに対 して、セリウム M 吸収端近傍でX 線吸収分光測定を行った。X線吸収

(901 eV) による解離生成物の飛 行時間スペクトルを図2に示す。解 離イオンとして CeO⁺、Ce⁺、Ce²⁺、 Ce³⁺などが観測された。なお Ar⁺



図2.X線(901 eV)吸収による Ce₂O₅⁺の解離スペクトル

はバックグラウンドガスのイオン化で生じたものである。これらの解離イオン収量の総和(全イオン収量)をX線エネルギーに対してプロットし、X線吸収スペクトルを得た。

図 3 に Ce₂O₃⁺および Ce₂O₅⁺のセリウム M 吸収端領域における X 線吸収スペクト ルを示す。セリウム M₅ および M₄ に対応するピークが見られたこれらスペクトルに ついて、Ce₂O₃⁺と Ce₂O₅⁺との間に次のような差異が見られる。

・ピークエネルギーのシフト

(Ce₂O₅⁺で M₄/M₅が増大)

・サテライトピークの有無

・ピーク強度比の変化

(図中矢印のように Ce₂O₅⁺で出現)

(Ce₂O₅⁺が高エネルギーにシフト)

このような差異がセリウムの荷電状 態と対応していることはバルクの研 究からよく知られている。すなわち、 これら X 線吸収スペクトルから、 $Ce_2O_3^+$ 中のセリウム原子が Ce(III) に近い荷電状態であるのに対し、 $Ce_2O_5^+$ では Ce(IV)に近いことが結 論できる。

講演では Ce₃O_n⁺の結果も示し、ク ラスターサイズ(組成)依存性につ いても検討を加える。さらに酸素吸 収端での測定結果も示して、セリウ ム原子、酸素原子双方の電子状態に ついて考察する。



図3. $Ce_2O_3^+$ 、 $Ce_2O_5^+$ のX線吸収スペクトル